

## СОДЕРЖАНИЕ

## НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

- Торхов Н. А., Никульникова Е. В.** Методы АСМ для контроля качества  $p^+ - n$ -переходов GaAs . . . . . 67
- Глухова О. Е., Шмыгин Д. С.** Закономерности электрической проводимости графен-нанотрубных пленок: новая универсальная методика вычисления функции пропускания . . . . . 78

## МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Корляков А. В., Лагош А. В.** Критерий оптимизации конструкции микромеханического ключа СВЧ диапазона . . . . . 87
- Щигорев Л. А.** Применение шины диагностики в задаче саморемонта блоков статической оперативной памяти . . . . . 98

## ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

- Ерошкин П. А., Петрунин Е. Ю., Шешин Е. П.** Рентгеновская трубка для ионизации газов . . . . . 107

## ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Александров П. А., Жук В. И., Литвинов В. Л., Стельмак С. Е.** О квадрировании транзисторов в нано- и микроцифровых интегральных схемах при их облучении . . . . . 111
- Шалимов А. С., Тимошенков С. П., Головинский М. С., Долговых Л. И., Калугин В. В., Чжо Мье Аунг.** Обеспечение работы и самокалибровки МЭМС-инклинометра в условиях воздействия различных внешних воздействующих факторов . . . . . 124